

**ФАНО РОССИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ**  
**ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ им. Н.С. КУРНАКОВА**  
**РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**  
**(ИОНХ РАН)**

119991, г. Москва, Ленинский проспект, 31. Тел. (495) 952-0787, факс (495) 954-1279, E-mail: info@igic.ras.ru



**Перечень выполняемых типовых работ и оказываемых услуг ЦКП ФМИ ИОНХ РАН**

- регистрация и анализ ИК-спектров веществ и материалов методами нарушенного полного внутреннего отражения, диффузного отражения и пропускания;
- люминесцентный анализ веществ и материалов;
- количественный элементный анализ веществ на содержание углерода, водорода, азота, серы;
- измерение теплоемкости материалов в широком температурном интервале;
- измерение термических характеристик твердых и порошкообразных неорганических веществ и материалов методом ДСК с регистрацией изменения их массы в диапазоне температур от 25 до 1500 °C;
- запись и анализ одно- и дву- мерных спектров ЯМР высокого разрешения жидких образцов на изотопах H-1, H-2, C-13, P-31, Pt-195, Si-29, N-14, N-15, O-17, Na-23, Al-23 и т.п. в интервале температур -50- +120°C;
- измерение спектров электронного парамагнитного резонанса в жидких и твердых образцах;
- рентгеноструктурный анализ монокристаллов;
- определение молекулярных и кристаллических структур неорганических, органических и металлоорганических соединений при различных температурах с последующим построением детального распределения электронной плотности;
- исследование низкотемпературных фазовых переходов;
- детальный анализ кристаллических упаковок с привлечением сведений из кристаллографических баз данных;
- качественный и количественный анализ кристаллических фаз;
- определение размеров кристаллитов;
- определение макро- и микронапряжений, изучение ближнего порядка кристаллов;
- измерение температурных и полевых зависимостей намагниченности, статической и динамической магнитной восприимчивости, теплоемкости транспортных свойств (удельное сопротивление, эффект Холла, критический ток) веществ и материалов в диапазоне магнитных полей до ± 9 Тл и температур 1,9 – 300 K;
- изучение микроструктуры поверхности и объемных материалов, в том числеnano- и биоматериалов (с увеличением до 900 000 x);
- локальный элементный анализ образцов;
- пробоподготовка для просвечивающей электронной микроскопии.

*Порядок определения стоимости типовых работ и оказываемых услуг осуществляется в соответствии с Приложением 1*

Приложение 1  
к Перечню выполняемых типовых работ  
и оказываемых услуг ЦКП ФМИ ИОНХ РАН

## **Порядок определения стоимости услуг ЦКП ФМИ ИОНХ РАН**

Стоимость типовых работ и оказываемых услуг определяется по формуле:

$$S = (F \cdot T + Z) \cdot K, \text{ где}$$

**S** - стоимость типовых работ и оказываемых услуг (руб.)

**F\*** - себестоимость одного часа работы необходимого оборудования (руб.),

**T** - фактическое количество часов, которое потребовалось для выполнения услуги (ч.)

**Z** - накладные расходы организации (руб.)

**K** - коэффициент сложности выполнения работ для предоставления услуги ( $1 < K \leq 10$ )

\*себестоимость одного часа работы на оборудовании ЦКП ФМИ ИОНХ РАН (*F*)  
определяется по следующей формуле:  $F = A + B + C + D + E$ , где:

*A*-амortизационные отчисления по оборудованию, участвующему в проведении испытания, измерения, исследования, руб. в час; *B*-затраты на содержание и обслуживание основного и вспомогательного оборудования, участвующего в проведении испытания, измерения, исследования руб. в час; *C* - затраты на оплату электроэнергии, руб. в час; *D* - затраты на расходные материалы, руб. в час; *E* -заработка плата оператора оборудования за один час работы, руб. в час.